(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-344903

(P2001-344903A)

(43) 公開日 平成13年12月14日 (2001: 12.14)

(51) Int. Cl. 7 G11B 20/10

識別記号

321

Filtra de la composición G11B 20/10

テーマコート

State of the State

321 Z 5D044

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全13頁):

特願2000-165833 (P-2000-165833)

(22) 出願日

平成12年6月2日(2000.6.2)

and the property of the state of the state of the space of Control of the Artist Artist Artist

the state of the state of

The state of the second of the second The British Course Service and the William Service Service

(71) 出願人 000005108 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地。

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地一株。 式会社日立製作所システム開発研究所内

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株:

式会社日立製作所システム開発研究所内

弁理士 富田 和子

さんとうのいいました。これに 本語 c 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】デジタル情報再生装置

Compared Mark Committee to the second (57)《**要約**》。 prife (Eshabited) [Wike et al. a. a. a. a.

【課題】 消費電力の増大を抑えつつ、高精度なフィル タパラメータ学習が行えるデジタル情報再生装置を提供 **する。** いっしょ west 。 g vg - 1980 -

【解決手段】:最尤推定部507は、デコーダ508に 送られる判定結果 d 1 とは別に、判定結果 d 1 と比較し て、判定誤り率は高いが、遅延が小さい第2の判定結果。 d 2を出力し、誤差信号生成部510は、第2の判定結 果d2とデジタルイコライザ506の出力から誤差信号 e 4を生成し、フィルタパラメータ学習部 5 1×1 は、誤 差信号 e 4 からデジタルイコライザ506のフィルタバ ラメータを学習する。

3781 1128 CX

【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体より再生されたアナログ再生信 号の帯域制限を行うアナログフィルタと、

1

前記アナログフィルタの出力信号をデジタル信号に変換 するA/D変換器と、前記A/D変換器の出力を波形等 化し、パーシャルレスポンス方式を実現するための波形 干渉を与えるデジタルイコライザと、

前記デジタルイコライザにより波形等化された信号から 最尤推定を行う最尤推定部と、

前記最尤推定部の出力から記録媒体に記録されたユーザ 10 ーデータを復号するデコーダと、

前記デジタルイコライザの出力から誤差信号を生成する 誤差信号生成部と、

前記誤差信号生成部の出力から前記デジタルイコライザ のフィルタパラメータを学習するフィルタパラメータ学 習部とを備え、

前記最尤推定部は、前記デコーダに送られる判定結果と は別に第2の判定結果を出力し、

前記誤差信号生成部は、前記第2の判定結果とデジタル イコライザの出力から誤差信号を生成することを特徴と 20 するデジタル情報再生装置。

【請求項2】 前記最尤推定部は、

メトリック及びパス選択情報を生成するメトリック演算 部と、

前記メトリック演算部の出力であるパス選択結果を保持 するパスメモリと、

前記パスメモリの最終段より前段のメモリの内容及び前 記メトリックを用いて前記第2の判定結果を得るMLセ レクタとを備えることを特徴とする請求項1に記載のデ ジタル情報再生装置。

【請求項3】 前記最尤推定部は、

メトリック及びパス選択情報を生成する第1及び第2の メトリック演算部と、

前記第1及び第2のメトリック演算部の出力であるパス 選択結果をそれぞれ保持する第1及び第2のパスメモリ とを備え、

前記第1のメトリック演算部及び前記第1のパスメモリ が、最尤推定の判定結果を出力し、

前記第2のメトリック演算部及び前記第2のパスメモリ が、前記第2の判定結果を出力し、

前記第2のパスメモリの長さが、前記第1のパスメモリ の長さより短いことを特徴とする請求項1に記載のデジ タル情報再生装置。

【請求項4】 当該デジタル情報再生装置外に誤差信号 情報を出力するための端子を備えたことを特徴とする請 求項1から請求項3のいずれか一項に記載のデジタル情 報再生装置。

【請求項5】 前記フィルタパラメータ学習部は、フィ ルタパラメータの調整を行うことが可能なレジスタを備 えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか 50 再生装置では、記録媒体より再生された信号に対し波形

一項に記載のデジタル情報再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録媒体からデジ タルデータを読み出すデジタル情報再生装置に関し、特 に、ビタビ復号器を用いた最尤推定器を備えたデジタル 情報再生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、磁気ディスク装置、磁気テープ装 置、光ディスク装置、光磁気ディスク装置等のデジタル 情報再生装置において、パーシャルレスポンス (PR: Pa rtialResponse) 方式を採用することが広く行われてい る。これは、デジタル情報を記録する記録媒体(磁気デ ィスク、磁気テープ、光ディスク、光磁気ディスク等) の記録密度が高くなるにつれ、従来用いられていたデジ タル情報を記録する方式の性能では、デジタル情報 1 ビ ットを記録する波形をその隣接するビットの記録による 影響(波形干渉)無しに書き込みにくくなったことによ

【0003】パーシャルレスポンス方式は、波形等化処 理部において積極的に既知の波形干渉を作り込むことに より、等化復号処理による信号性能の劣化を防ぐもので ある。このようなパーシャルレスポンス方式に最尤推定 法であるML (Maximum Likelihood) 方式を組み合わせ ることにより、高精度な信号処理を可能としたPRML (Partial Response Maximum Likelihood) 方式も実用 化されている。

【0004】PRML方式は、与えられる波形干渉の形 から多くの方式が生み出されている。特に磁気ディスク 装置では、PR(1, 1, -1, -1) (EPRML: Extended PRML)、P 30 R(1, 2, 0, -2, -1) (EEPRML: Extended EPRML) 等のクラス 4のPRML系の方式が用いられている。磁気ディスク におけるPRML系の信号処理方式については、例え ば、文献:IEEE Transactions on Magnetics, Sep. 199 9, Vol. 35, Num. 5, pp. 4378-4386, "Rate 16/17 Maximu m Transition Run (3:11) Code on an EEPRML Channel with an Error-Correcting Postprocessor"に記載され ている。

【0005】一方、光ディスク装置では、PR(1,1)、PR (1, 2, 2, 1) 等の方式が用いられている。光ディスク装置 におけるPRML系の信号処理方式については、例え ば、特開平9-17130号公報及び特開平10-11 2030号公報に記載されている。

【0006】これらPRML系の信号処理方式は、PR ML系の信号処理方式を用いない方式、すなわち波形干 渉を与えずに復号操作を行う方式と比較し、高精度な信 号処理が可能で、その信号処理部の搭載されている装置 の記録性能を向上させることが出来る。

【0007】このようなPR方式を用いたデジタル情報

(2)

40

干渉を除去したり、信号の帯域を制限したり、所望した 波形干渉を作り込む為のフィルタ手段が必要である。 【0008】図10は、従来の磁気ディスク装置におけ る信号処理部100の構成を示す図である。

【0009】同図に示すように、記録媒体に書き込まれて たデジタル情報は、ヘッド 1-0-1 から読み出され、アン プ102により増幅される。増幅された信号は、可変利 得アンプ (VGA) 103によって適切な振幅となるよ うに調整され、アナログフィルタ(AF)104に送ら れる。A F 1 0 4 は、後段の A / D変換器 (ADC) 1 : 10 0.5によりサンプリングされる際にノイズとなる信号の 高周波成分を除去する。なお、AF-1-0 4は、後段の等。 化器により所望の波形干渉を作りやすいよう波形等化を 行う場合もある。トルマリでは高。 ごりをそれられたぐで

【0.0月、0】高周波成分が除去されたアナログ信号は、 ADC105によりデジタル信号に変換される。にのデ ジタル信号は、n.タップのトランスパーサル型デジタル イコライザ (DEQ) 1.0,6において波形等化が行われ、 る。波形等化が行われた信号は既知の波形干渉が作り込む まれ、最尤推定部1,0.7において最尤復号が行われる。 20 信号生成部21,0から得られた誤差信号 e 2 と D.E.Q 2 この復号値は、デコーダ10.8によって復号化処理が行 われユーザーデータとなり、信号処理部1,0,0の出力と なる。信号処理部1.0.0の出力は、図示しないハードデー ィスクコントローラ(HDC)及びインターフェイス等。 を介し、一磁気ディスク装置外部のコンピュータ等のホス トに送信される。大き生丸まし段変元後に八万及ぐにはイ 【0.05151】また、DEQ-1-06の出力信号は、判定器。 109の入力となり、判定器 109では、誤差信号を作べ るための一時的な判定が行われ、判定結果が出力される会 及びDEQ106の出力信号を用いて誤差信号e1を生」 成する。、りょく、は熱は能に関端的します。こともは、

【0.0.1 2】フィルタパラメータ学習部1.1.1は、誤差 信号生成部 1.10 から得られた誤差信号 e 1とDEQ 1 06の入力等の情報を用いてDEQ106のパラメータ の変更を行う。これ、ロースとして関係をしまないとします。

【0013】図11は、従来の光ディスク装置における。 信号処理部200の構成を示す図である。

【001.4】、同図に示すように、記録媒体に書き込まれ、 たデジタル情報は、光学ピックアップ (光学ヘッド) 2: 40: 01から読み出され、プリアンプ202により増幅され、 る。増幅された信号は、可変利得アンプ(VGA)20; 3によって適切な振幅となるように調整され、アナログ。 フィルタ (AF) 204に送られる。AF204は、後一 段のA/D変換器(ADC)205によりサンプリング される際にノイズとなる高周波成分を除去する。なお、 AF204は、後段の等化器により所望の波形干渉を作 りやすいよう波形等化を行う場合もある。

【0015】高周波成分が除去されたアナログ信号は、 ADC205によりデジタル信号に変換される。このデ 50

ジタル信号はデジタルイコライザ(DEQ)206によ り波形等化が行われる。なお、AF204によって十分 に波形等化が行われている装置では、。DEQ206は必 要とされない場合もある。

【0016】波形等化が行われた信号は既知の波形干渉 が作り込まれ、最尤推定部207において最尤復号が行 われる。この復号値は、デコーダ208によって復号化 処理が行われユーザーデータとなり、信号処理部200 の出力となる。信号処理部2:00の出力は、図示しない 光ディスクコントローラ (ODC) 及びインターフェイ ス等を介し、光ディスク装置外部のコンピュータ等のホ ストに送信される。「ペニュートス・・ハー・コー・コート 【0 0 1 7】また、D-E Q 2 0 6 の出力信号は判定器 2 × 09の入力となり、判定器209では、誤差信号を作る。 ための一時的な判定が行われ、判定結果が出力される。 誤差信号生成部 2.1 0は、判定器 2.0 9 の判定結果及び DEQ206の出力信号を用いて誤差信号 e-2 を生成す。 **る。** Elizab Not / Leng 医野体 (日本) と 所に地面 ログ (1) Leng

【0018】フィルタパラメータ学習部2.1/1は、誤差。 06の入力等の情報を用いてDEQ206のパラメータ の変更を行う。 【0.031 9】 かららんが結ける かりは続けいてりににしる

【発明が解決しようとする課題】PRML等の信号処理 を行う場合は、そのような信号処理を行わない場合と比 較し、信号処理部へ入力される信号のSN比は悪く、判。 定器 1:0.9、2.0:9:における判定結果の誤り率が相対的。 に高くなる。また、最尤推定部出力の誤り率を一定とし、 た場合、この判定誤り率の上昇はい用いる、P:R方式がEII る。誤差信号生成部。1·1 0は、判定器。1 0.9 の判定結果、30 PRML、EEPRMLと与える波形干渉が複雑になる。 ほど顕著となる。ほこうは、おおされませいで、お器型等のは 【0020】判定器109、209の入力信号の品質が高 十分に高い場合は、一時的な判定結果の誤りにより誤差 信号の品質劣化が起こっても、その後の誤りが起こらな、 かった時点の誤差信号によって誤った方向へフィルタ学 習が進むことが制限されるため、信号処理部の出力でので 信号の誤り率の劣化は起こりにくい。これを(ロー・ハー

> 【0021】しかし、媒体上に記録されている信号の性 能劣化や信号処理部内の雑音の増加、信号処理部内のパー ラメータの設定誤差などにより判定器109、209の : 入力信号の品質が著しく劣化した場合は、一時的な誤差し 信号の品質劣化がフィルタパラメニタを最適な設定からし 離れた点に学習させ、この学習結果が最適な設定近辺には 復帰するまでの間、信号処理部の出力での信号の誤り率 が増大し、装置全体の性能劣化が起こることになる。.

【0022】また、上記したような一時的な誤差信号の 品質劣化がフィルタパラメータを最適な設定から離れた 点に学習させることにより、判定器109、209の入 力信号の品質劣化が引き起こされ、連続的な判定誤りが 誘発され、更なる誤差信号の品質劣化につながることに

5

もなる。このような現象が発生すると、信号処理部の出 力での信号の誤り率が増大し、装置全体の性能がますま す劣化することになる。

【0023】図12は、PR(1,0,-1)ML方式を用いた磁気ディスクにおける判定器109時点での等化信号の分布を示す図である。同図に示した例では、等化信号は11,0,-1)の3値のいずれかを目標とし等化されるが、斜線部においては、信号レベル弁別のような簡易判定では、判定誤りを起こす。この判定誤り率は、ML部の判定誤り率の少なくとも数倍以上となり、フィルタパラメータ 10の学習の安定性が低下する。

【0024】このような問題を解決するため、最尤復号後の信号を用いてフィルタパラメータの更新を行う方式が考えられる。

【0025】図13は、フィルタパラメータの更新に最 尤復号後の信号を用いる方式を採用した磁気ディスク装 置における信号処理部400の構成を示す図である。同 図において前述の符号と同一の符号が付された構成要素 は同様の特徴を持つものである。

【0026】同図に示すように、媒体に書き込まれたデ 20 ジタル情報は、ヘッド101、アンプ102、VGA1 03、AF104、ADC105、DEQ106、最尤推定部407にて順に処理され復号が行われる。最尤推定部407から出力された判定結果は、図10の判定器 109の判定結果と比較して判定誤り率が低く、品質が向上している。

【0027】遅延器412は、最尤推定部407の判定結果と対応の取れたDEQ出力信号を生成するため、DEQ106の出力を適切なクロック数遅延させる。誤差信号生成部410は、最尤推定部407による判定結果 30及び遅延器412の出力信号を用いて誤差信号e3を生成する。

【0028】フィルタパラメータ学習部411は、誤差信号生成部410から得られた誤差信号e3とDEQ106の入力等の情報を用いてDEQ106のパラメータの変更を行う。

【0029】図13に示した信号処理部400では、判定誤りによりフィルタパラメータが不適切な設定へ学習される可能性は小さくなる。従って、連続的な判定誤りが誘発されるなど、装置全体の判定誤り率の増大による 40性能劣化が起きにくくなる。

【0030】しかし、最尤推定部407に等化出力が入力されてから推定結果が出力されるまでには大きな遅延が伴う。例えば、最尤推定部407内のACS(Add-Compare-Select)回路、パスメモリなどで数十クロックの遅延が予想され、この場合、遅延器412は、DEQ出力ビット幅×遅延段数というサイズの遅延回路を持つ必要がある。また、フィルタパラメータ学習部411において、フィルタパラメータの学習の際にDEQ106の入力を必要とする場合には、フィルタパラメータ学習部50

にも、DEQ入力ビット幅×遅延段数というサイズの遅延回路を備える必要がある。これらの回路を設けると、回路サイズが増大し、装置全体の消費電力が増大する。

【0031】本発明の目的は、消費電力の増大を抑えつつ、高精度なフィルタバラメータ学習が行えるデジタル情報再生装置を提供することにある。

[0032]

【課題を解決するための手段】本発明に係るデジタル情 報再生装置は、記録媒体より再生されたアナログ再生信 号の帯域制限を行うアナログフィルタと、前記アナログ フィルタの出力信号をデジタル信号に変換するA/D変 換器と、前記A/D変換器の出力を波形等化し、パーシ ャルレスポンス方式を実現するための波形干渉を与える デジタルイコライザと、前記デジタルイコライザにより 波形等化された信号から最尤推定を行う最尤推定部と、 前記最尤推定部の出力から記録媒体に記録されたユーザ ーデータを復号するデコーダと、前記デジタルイコライ ザの出力から誤差信号を生成する誤差信号生成部と、前 記誤差信号生成部の出力から前記デジタルイコライザの フィルタパラメータを学習するフィルタパラメータ学習 部とを備え、前記最尤推定部は、前記デコーダに送られ る判定結果とは別に第2の判定結果を出力し、前記誤差 信号生成部は、前記第2の判定結果とデジタルイコライ ザの出力から誤差信号を生成することを特徴とする。

【0033】この場合において、前記最尤推定部は、メトリック及びパス選択情報を生成するメトリック演算部と、前記メトリック演算部の出力であるパス選択結果を保持するパスメモリと、前記パスメモリの最終段より前段のメモリの内容及び前記メトリックを用いて前記第2の判定結果を得るMLセレクタとを備えるようにしてもよい。

【0034】また、前記最尤推定部は、メトリック及びパス選択情報を生成する第1及び第2のメトリック演算部と、前記第1及び第2のメトリック演算部の出力であるパス選択結果をそれぞれ保持する第1及び第2のパスメモリとを備え、前記第1のメトリック演算部及び前記第1のパスメモリが、最尤推定の判定結果を出力し、前記第2のメトリック演算部及び前記第2のパスメモリが、前記第2の判定結果を出力し、前記第2のパスメモリの長さが、前記第1のパスメモリの長さより短くするようにしてもよい。

【0035】更に、以上の場合において、前記デジタル情報再生装置は、当該装置外に誤差信号情報を出力するための端子を備えるようにしてもよい。誤差信号情報には、例えば、誤差信号生成部から出力される誤差信号や、その誤差信号を積分したものが該当する。また、前記フィルタパラメータ学習部は、フィルタパラメータ調整を行うことが可能なレジスタを備えるようにしてもよい。

【0036】また、前記デジタル情報再生装置におい

て、前記ユーザーデータを前記記録媒体に記録できるよ うにしてもよい。 1.6

[003.7]:

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て、図面を参照しつつ、詳細に説明する。なお、既に説 明のあった符号と同一の符号を付した構成要素は、同一 の動作をするものとし、動作の説明は省略する。

【0038】《第1の実施の形態》図1は、本発明によ るデジタル情報再生装置の信号処理部の構成を示すプロ ック図である。なお、以下では、本デジタル情報再生装 10 置が、PR (1, 0, -1) ML方式を採用している場合について説 明するが、他のPRML方式についても同様である。 【0039】同図に示すように、信号処理部500は、 アンプ502と、VGA503と、AF504と、AD C505と、DEQ506と、最尤推定部5.0%と、デ コーダ508と、誤差信号生成部510と。フィルタパ ラメータ学習部511と、遅延器512、513とを備り - 株式の方式の一点舗の森田では竹木のだって

【0040】記録媒体に書き込まれたデジタル情報は、 ヘッドやピックアップ等から読み出され、その後、アン、20 プ502、VGA503; AF504、ADC505、 DEQ506により順次処理され、最大推定部507にxx より最尤復号が行われるのは前述した方式と同様であ る。 1. Oak 1 1. Oak 1

【0041】最尤推定部507による判定結果は1は、 デコーダ 508により復号化処理が行われ信号処理部5% 00の出力となる。最尤推定部507は、判定結果 d1 に加えて第2の判定結果d2を生成する。第2の判定結、 果d2は、判定結果d1と比較して、判定誤り率は高い。 が、最尤推定部<u>507の入力に対するクロック遅延が小。30.002</u>nにより誤差信号 e 4を乗算される。乗算結果 さいという性質を持つ。第2の判定結果は2の生成方法。 については後述する。これ、カルンドルス・ロート語は入げる。

【0042】遅延器512は、第2の判定結果は2と対 応が取れるよう、DEQ506の出力信号を最尤推定部 507内のクロック遅延時間分だけ遅延させる。誤差信 号生成部510は、遅延器512により遅延されたDE。 Q506の出力及び第2の判定結果d2を用いて誤差信. 号e4を生成する。

【0043】遅延器513は、誤差信号e4と対応が取: れるよう、DEQ506の入力信号を「最尤推定部50 40、 7内のクロック遅延時間+誤差信号生成部510の処理 時間」分だけ遅延させる。

【0044】フィルタパラメータ学習部511は、遅延 器513により遅延されたDEQ506の入力及び誤差 信号e4を用いてDEQ506のパラメータの変更を行 う。

【0045】次に、誤差信号生成部510の構成につい。 て説明する。図2は、誤差信号生成部510の構成を示 すブロック図である。

【0046】同図に示すように、誤差信号生成部510 50

は、目標振幅生成部601と、減算器602とを備え

【0047】誤差信号生成部510に入力された第2の 判定結果 d 2 は、遅延器 5 1 2 の出力と信号レベルが異 なる場合があり、その場合は、同じ信号レベルになるよ う調整する必要がある。また、最尤推定部507の出力 は、最尤推定部内のパスメモリのビット幅数削減のた め、ライトカレントを表す2値の信号となっているの で、遅延器512の出力に対する誤差信号を求めるた め、第2の判定結果 d 2 は、PR (1, 0, -1) 等化結果との整 合性が取られなければならない。そこで、目標振幅生成 部6.0 1は、用いているパーシャルレスポンス方式にあ った既知の波形等化を畳み込む動作を行う。この場合、 目標振幅生成部6.0.1 にて畳み込まれる干渉は、(1-D) (1+D) (1+D) であれば良い。目標振幅生成部601の出力。 は、減算器602にて、遅延器512の出力を減算され 誤差信号 e 4となる。 The transfer of American

【0.048】次に、フィルタパラメータ学習部511の 構成について説明する。図3は、フィルタパラメータ学 習部511の構成を示すブロック図である。

【0.049】同図に示すように、フィルタパラメータ学 習部511は、(n-1)個の遅延器701<u>2</u>1~70: 1_(n-1)と、n個の乗算器702_1~702、 nと、n個の積分器 7 0 3 <u>1</u> 1 ~ 7 0 3 <u>n</u> n と、n 個の 判定器704二1~704_nと、レジスタ705と、 マルチプレクサ7.0.6 とを備える。 コペニュニス・バー 【0050】フィルタパラメータ学習部5.1.1に入力さ れた遅延器513の出力は、遅延器701 1~701 3

__(n-1)によって遅延され、乗算器 7 0 2 <u>2</u> 1~7 は、それぞれ、積分器 7 0 3 <u>1</u> 1 ~ 7 0 3 <u>1</u> n により積 分される。それぞれの積分器の積分期間は、レジスタ7 05の設定値により規定される。レジスタ705の設定 値は、例えば、フィルタパラメータ学習部511分部よ り与えられる。

【0051】それぞれの積分器703_1~703_n による積分結果は

シ判定器 7 0 4 __ 1 ~ 7 0 4 __ n によっ リレベル判定が行われる。判定器704による判定結果 はマルチプレクサ (MUX), 706を介してDEQ50 6に送られる。MUX706にて束ねられたn個の判定 結果は、それぞれ、DEQ506内のnタップのトランジ スパーサルフィルタの各フィルタパラメータを更新する。 ために用いられる。パングではは、アーバー現代課意では

【0052】判定器704の判定基準は、積分結果があ るしきい値を絶対値で超えた場合に、DEQ506の係 数を積分結果がしきい値を超えた方向に微少量変化する ように設定すればよい。なお、判定器のしきい値は、レ ジスタ705の設定値によって変更できるようにしても よい。また、より精度良く学習の調整を行うためには、 判定器の入出力が図4に示すように階段状関数となるよ

Q

うにすればよい。

【0053】次に、第2の判定値d2を生成する最尤推 定部507の構成について説明する。

【0054】図5は、最尤推定部507の構成を示すプロック図である。

【0055】同図に示すように、最尤推定部507は、 メトリック演算部801と、パスメモリ802と、ML セレクタ803、804とを備える。

【0056】メトリック演算部801は、最尤推定部507に入力された信号値とトレリス遷移の各枝に対応す10る目標信号値とのユークリッド距離を各時刻計算する。そして、メトリック演算部801は、各時刻において現在の状態に至るパスのうちもっとも確からしいパスのパスメトリック値を計算し、生き残りパスの一時刻前の状態を選択し、その選択に従う推定結果をパスメモリ802に格納する。

【0057】パスメモリ802は、用いるPRML方式の持つ状態数と同じ数のシフトレジスタを備える。各シフトレジスタは、あらかじめ定められた個数の推定結果を一時刻毎にシフトしながら保持する。メトリックス演 20 算部801から出力された推定結果は、シフトレジスタの最前段に格納され、それに伴って内部で保持していた推定結果が一時刻分ずつシフトされる。ただし、そのシフトに際して、選択された生き残りパスの一時刻前の状態に対応するシフトレジスタの保持する推定結果のコピーが行われる。これにより、推定に伴うパスの選択により生き残りパスが次第に少なくなっていくとコピーの回数が多くなり、パスメモリ内の複数のシフトレジスタの最終段に残る推定結果はおおむね同じ結果となる。

【0058】MLセレクタ803は、パスメモリ802 30 の最終段の内容とメトリック演算部801より出力された最も確からしいパスのパスメトリック値を用いて推定される復号値を算出し、最尤推定部507の出力(判定値d1)とする。なお、パスメモリ802のパスメモリ長が十分に長い場合は、MLセレクタ803は、必要とされない。

【0059】MLセレクタ804は、MLセレクタ803と同じ動作をするブロックであるが、パスメモリ802の中間段(すなわち、シフトレジスタの中間段)の内容と、メトリック40演算部801より出力された最も確からしいパスのパスメトリック値とを用いて推定される復号値を算出して、第2の判定値d2として出力する。第2の判定値d2は、判定値d1と比較し、判定誤りを起こす確率は高いが、最尤推定部507の入力に対するクロック遅延は小さい。また、最尤判定を行っていない判定器109、209の出力と比較して判定誤りを起こす確率は低い。なお、パスメモリ中間段の具体的な位置については、要求される誤り率その他の実装条件に応じて、適当な位置が選択される。50

[0060]以上説明したように構成されたデジタル情報再生装置においては、図10及び図11に示したデジタル情報再生装置と比較し、再生信号のSN比の悪い条件においてもフィルタパラメータ学習部が不適切に学習される可能性が小さくなる。

【0061】従って、適応学習中に適切なパラメータが 設定され、良好なエラーレートで復号を行うことができ る。つまり、再生信号の誤り率を低下させ、装置の信頼 性を高めたり、記録密度を更にあげたりすることが可能 になる。または、従来と同程度のデータ誤り率を確保し つつ、媒体、ヘッド、ピックアップ、モータなどの信号 処理部以外の部品の性能の許容スペックを下げることが 可能になる。

【0062】また、以上に説明したように構成されたデジタル情報再生装置においては、図13に示したデジタル情報再生装置と比較し、デジタルイコライザの出力等を遅延させる遅延器の遅延回路量を小さくすることが出来る。このことにより、復号誤り率の劣化を招くことなく、デジタル情報再生装置の消費電力を小さくすることが出来る。

【0063】《第2の実施の形態》次に、前述した最尤 推定部507の別の構成方法について説明する。

【0064】図6は、最尤推定部の別の構成を示すブロック図である。

【0065】同図に示すように、最尤推定部507aは、波形干渉生成部901と、メトリック演算部902、905と、パスメモリ903、906と、MLセレクタ904、907とを備える。最尤推定部507aは、用いるパーシャルレスポンスの形が2種類である点が図5に示した最尤推定部507と異なる。

【0066】波形干渉生成部901は、最尤推定部507aの入力信号に与えられている波形干渉より更に応答の長い波形干渉を入力信号に与える。たとえば、最尤推定部507aの入力がPR(1,0,-1)MLの干渉が与えられている場合で、後段の最尤推定がEPR(1,1,-1,-1)MLを用いている場合、入力信号の波形干渉が最尤推定器の設計値と合うように不足している(1+D)という波形干渉が与えられる。

【0067】波形干渉生成部901により波形干渉を与えられた信号は、メトリック演算部902に入力される。メトリック演算部902は、入力された信号値とトレリス遷移の各枝に対応する目標信号値とのユークリッド距離を毎時刻計算する。そして、メトリック演算部902は、各時刻において現在の状態に至るパスのうちもっとも確からしいパスのパスメトリック値を計算し、生き残りパスの一時刻前の状態を選択し、その選択に従う推定結果をパスメモリ903に格納する。

【0068】パスメモリ903は、前述したパスメモリ802と同様に、メトリック演算部902から出力され 50 た推定結果を保持するシフトレジスタを備え、前述した

วบ

12

パスメモリ802と同様のシフト動作を行う。

【0069】MLセレクタ90.4は、パスメモリ903。 の最終段の内容とメトリック演算部902より出力される たもっとも確からしいパスのパスメトリック値を用いて 推定される復号値を算出し、最尤推定部507aの出力。 (判定値は1),とする。パスメモリ903のパスメモリ 長が十分に取られている場合は、MLセレクタ904は、 必要とされない。

【0070】メトリック演算部9.05、パスメモリ9.0. 6 及びM₂L-セレクタ 9 0 7 による第 2 の最尤推定部は、 10 メトリック演算部902、パスメモリ903及びMLセ レクタ904による最尤推定部と比較し、状態数の少な いより単純なパーシャルレスポンスを用いて復号操作を 行う。これをもはは、難いととしただけのを持っての主催し

【0071】メトリック演算部905は、入力された信。 号値とトレリス遷移の各枝に対応する目標信号値とのユ ークリッド距離を各時刻計算する。そして、メトリック、 演算部905は、各時刻において現在の状態に至るパス のうちもっとも確からしいパスのパスメトリック値を計り 算し、生き残りパスの一時刻前の状態を選択し、その選 20 ク装置1100は、データが書き込まれている磁気ディ 択に従う推定結果をパスメモリ906に格納する。

【0072】パスメモリ906は、前述したパスメモリ 802と同様に、メトリック演算部905から出力され た推定結果を保持するシフトレジスタを備え、前述した パスメモリ802と同様のシフト動作を行う。なお、パ スメモリ906の長さ(シフトレジスタの段数)は、パ スメモリ903より短い。 🚋 1000000

【0073】MLセレクタ907は、パスメモリ906 の最終段の内容とメトリック演算部905より出力され た最も確からしいパスのパスメトリック値を用いて推定 30 される復号値を算出し、第2の判定値 d 2 として出力す

【0074】この場合の第2の判定値d2も、判定値d 1と比較し、判定誤りを起こす確率は高いが、最尤推定 部内で処理される間の遅延時間は短い。また、第2の判 定値 d 2 は、最尤判定を行っていない判定器 1 0 9 、 2 09の出力と比較し判定誤りを起こす確率は低い。つま り、前述した第1の実施形態と同様の効果を得ることが

【0075】《第3の実施の形態》図7は、本発明によ るデジタル情報再生装置における信号処理部の別の構成 例を示すブロック図である。

【0076】同図に示すように、信号処理部1000 は、図1に示した信号処理部500に、装置外部から誤 差信号 e 4 の品質をモニタするためのモニタ端子100 1を追加したものである。

【0077】また、モニタ端子1001から出力された 誤差信号 e 4 の品質に応じてフィルタパラメータ学習部 511内のレジスタの設定値及びDEQ506のパラメ ータを変更する調整機構を持つ。すなわち、装置外から 50 与えられる調整信号により、フィルタパラメータ及びフ ィルタパラメータ学習部511内のレジスタの設定値を 変更することが出来る。

【00.78】以上のように構成された信号処理部100 0を持つデジタル情報再生装置は、前述したデジタル情 報再生装置と同様の効果を持つと共に、信号処理部10 00と、信号処理部1000以外のデジタル情報再生装 置の各ブロックとの特性を合わせるための初期設定操作 を容易に行うことが出来る。また、媒体の性質が変化す るなどして、等化器の性質を変化させる必要がある場合。 等の再設定が容易になる。

【0079】なお、図7に示した例では、誤差信号e4 を直接外部に出力するように構成しているが、モニタ端と 子1001の前段に積分器を設けて、誤差信号 e 4を積 分した結果を出力するようにしてもよい。 ジャラ 電風 エ 【0080】次に、前述した信号処理部を用いた磁気デ ィスク装置の構成について説明する。

【0081】図8は、本発明による磁気ディスク装置の 構成を示す図である。同図に示すように、本磁気ディス スク1101と、磁気ディスク1101を回転させるス・ ピンドル1102と、磁気ディスク1101からデータ・ の読み出し及び書き込みを行う磁気ヘッド1103と、 磁気ヘッド1103を支えるアーム1104と、磁気へ ッド1103を移動させるためのボイスコイルモータ1 105と、スピンドル1102を回転させるスピンドル モータ1106とを備える記念論語 画書 しょう と

【0082】また、上記以外の制御部として、更に、情・ 報処理装置(ホスト)1108に接続するためのインタ) ーフェイス (1/F) 1109と、データの受け渡し及言 びフォーヌットなどの制御をするハードディスクコントッ ローラ (HDC)\A.1-1-0となるイコン (CPU): 1.1--11と、磁気ヘッド1103からの信号を処理する信号 処理部1107と、スピンドルモータ1106を制御す。 るためのスピンドル制御回路 (SMC) 11112と、ボ イスコイルモータ1105を制御するポイスコイルモー・ 夕制御回路(VCMC)1113とを備える。

【0083】ここで、信号処理部十107は、前述した 実施形態のいずれかと同様の構成を有している。従っい て、磁気ディスク11 0×1 から読み出された S N比等の。 性能の悪い信号についても誤り率を従来より低くするこ とができ、復号結果の誤り率を低下させた磁気ディスク 装置を実現できる。

【0084】なお、信号処理部1107を磁気ディスク 装置に搭載する際には、媒体、ヘッド、モータ等の品質・ に応じてフィルタパラメータ学習部に設けられているレ ジスタに適当な値を設定する操作が必要な場合もある。 この操作は、製品出荷時に磁気ディスク装置内の設定を 行う際に行われ、信号処理部1107から出力される復 号結果の誤り率もしくは等化誤差の品質にしたがってレ

14

13

ジスタ内容が設定される。

【0085】次に、前述した信号処理部を用いた光ディ スク装置の構成について説明する。

【0086】図9は、本発明による光ディスク装置の構 成を示す図である。

【0087】同図に示すように、本光ディスク装置12 00は、データが書き込まれている光ディスク1201 と、光ディスク1201を回転させるスピンドル120 2と、光ディスク1201からデータの読み出し及び書 き込みを行う光学ピックアップ1203と、光学ピック 10 アップのフォーカシング制御及びトラッキング制御を行 うアクチュエータ1204と、スピンドル1202を回 転させるスピンドルモータ1205とを備える。

【0088】また、上記以外の制御部として、更に、情 報処理装置(ホスト)1207に接続するためのインタ ーフェイス (I/F) 1208と、データの受け渡し及 びフォーマットなどの制御をする光ディスクコントロー ラ (ODC) 1209と、マイコン (CPU) 1210 と、光学ピックアップ1203からの信号を処理する信 号処理部1206と、スピンドルモータ1205を制御 20 するためのスピンドル制御回路(SMC)1211と、 アクチュエータ1204を制御するアクチュエータコン トローラ (AC) 1212とを備える。

【0089】ここで、信号処理部1206は、前述した 実施形態のいずれかと同様の構成を有している。従っ て、光ディスク1201から読み出されたCN比(キャ リア/ノイズ比)等の性能の悪い信号についても、復号 結果の誤り率を低減した光ディスク装置を実現できる。

【0090】なお、信号処理部1206を光ディスク装 置に搭載する際には、媒体、光学ピックアップ、モータ 30 等の品質に応じてフィルタパラメータ学習部に設けられ ているレジスタに適当な値を設定する操作が必要となる 場合もある。この操作は、製品出荷時に光ディスク装置 内の設定を行う際に行われ、信号処理部1206から出 力される復号結果の誤り率もしくは等化誤差の品質にし たがってレジスタ内容が設定される。

[0091]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に よれば、消費電力の増大を抑えつつ、高精度なフィルタ パラメータ学習が行えるので、記録媒体から読み出され 40 たSN比等の性能の悪い信号についても誤り率を従来よ り低くしたり、または、同程度の誤り率を保証しつつ、 媒体、ヘッド、ピックアップ、モータ等の信号処理部以 外の部品の性能の許容スペックを下げることができる。

【図面の簡単な説明】

本発明の第1の実施形態による信号処理部の 【図1】 構成を示したブロック図である。

【図2】 本発明の第1の実施形態による誤差信号生成 部の構成を示したブロック図である。

【図3】 本発明の第1の実施形態によるフィルタパラ 50 802、903、906 パスメモリ

メータ学習部の構成を示したブロック図である。

【図4】 フィルタパラメータ学習部内の判定器の判定 基準の例を示した図である。

【図5】 本発明の第1の実施形態による最尤推定部の 構成を示したブロック図である。

【図6】 本発明の第2の実施形態による最尤推定部の 構成を示したブロック図である。

本発明の第3の実施形態による信号処理部の 【図7】 構成を示したブロック図である。

【図8】 本発明による磁気ディスク装置の構成を示し たブロック図である。

【図9】 本発明による光ディスク装置の構成を示した ブロック図である。

【図10】 従来の磁気ディスク装置の信号再生系の構 成を示したブロック図である。

【図11】 従来の光ディスク装置の信号再生系の構成 を示したブロック図である。

【図12】 デジタルイコライザ出力の振幅の分布を表 した図である。

【図13】 フィルタパラメータの更新に最尤復号後の 信号を用いる磁気ディスク装置の信号再生系の構成を示 したブロック図である。

【符号の説明】

100、200、400、500、1000 信号処理

101 ヘッド

102、202、502 アンプ

103、203、503 可変利得アンプ

104、204、504 アナログフィルタ

105、205、505 AD変換器

106、206、506 デジタルイコライザ

107、207、407、507、507a 最尤推定

108、208、508 デコーダ

109、209 判定器

110、210、410、510 誤差信号生成部

111、211、411、511 フィルタパラメータ 学習部

201 ピックアップ

412、512、513 遅延器

601 目標振幅生成器

602 減算器

701_1~701_ (n-1) 渥延器

702_1~702_n 乗算器

703_1~703_n 積分器

704 1~704 n 判定器

705 レジスタ

706 マルチプレクサ

801、902、905 メトリック演算部

開2001-344903

16

803、804、904、907 MLセレクタ

15

901 波形干渉生成部

1001 モニタ端子

1100 磁気ディスク装置

1101 磁気ディスク

1102、1202 スピンドル

1103 磁気ヘッド

1104 アーム

1105 ボイスコイルモータ

1106、1205 スピンドルモータ

1107、1206 信号処理回路

1108、1207 ホスト

1109、1208 インターフェイス

1110 ハードディスクコントローラ

11,11、1210 マイコン

1112、1211 スピンドル制御回路

1113、1212 ボイスコイルモータ制御回路

1200 光ディスク装置

1201 光ディスク

1203 光学ピックアップ

10 1204 アクチュエータ

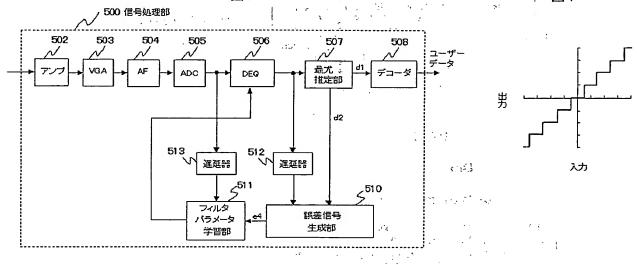
-1209 光ディスクコントローラ

【図1】

図1

【図4】

図4



【図2】

図2

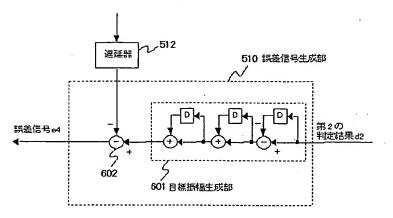
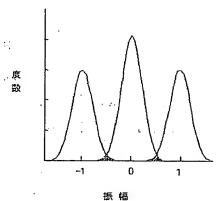
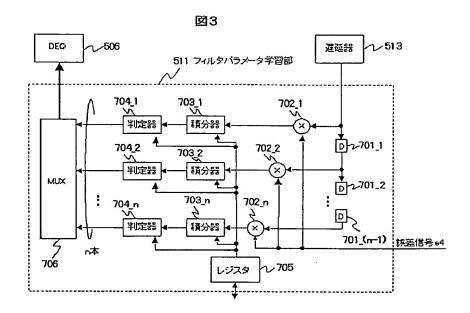


図12

【図12】

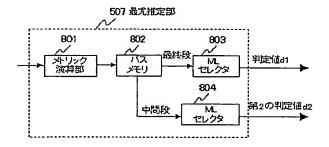


【図3】



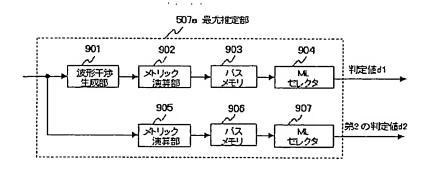
【図5】

図5



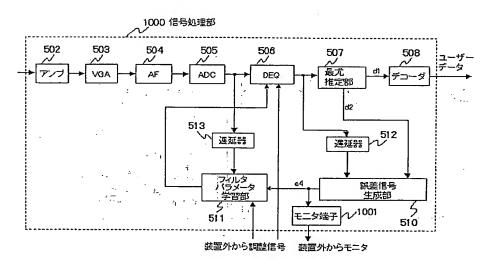
【図6】

図6



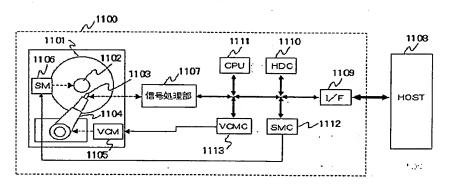
【図7】

図7



【図8】

図8



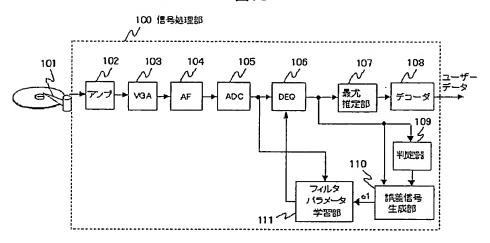
【図9】

図9

1200 ~ 1207 N ~ 1201 1210 1209 1202 1205 /\/_ CPU ODC 1206 1208 SM 信号处理部 **i∕**F HOST SMC 1211 AC 1212

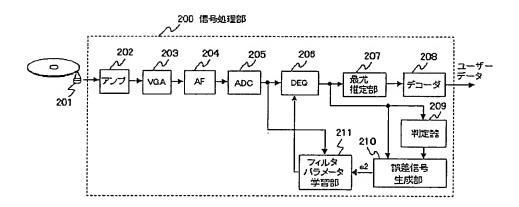
【図10】

図10



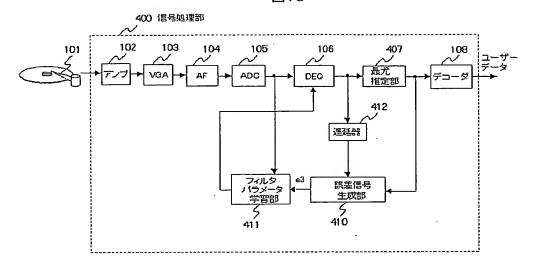
【図11】

図11



【図13】

図13



フロントページの続き

(72) 発明者 西谷 卓史

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株

式会社日立製作所システム開発研究所内

(72) 発明者 奈良 孝

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

(72) 発明者 中井 信明

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

(72) 発明者 井出 博史

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

(72) 発明者 石田 嘉輝

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会 社日立製作所ストレージシステム事業部内

Fターム(参考) 5D044 BC01 CC04 FG02 FG05 FG16

GL02 GL32

This Page Blank (uspto)